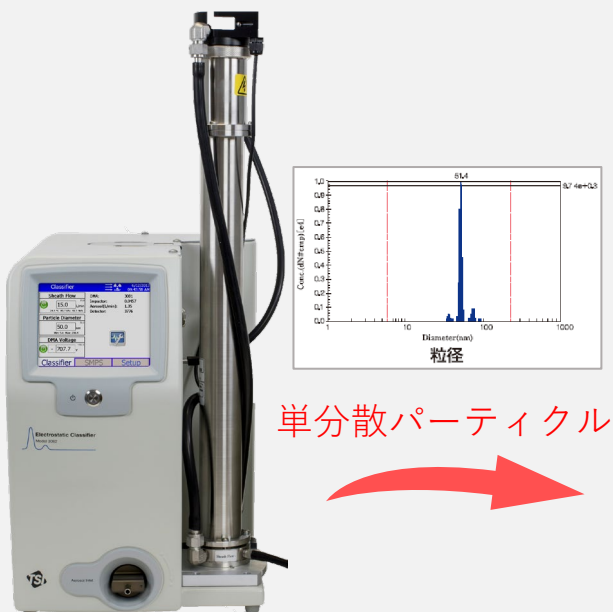


SEM/EDX分析対応 シングルナノ粒子捕集

半導体プロセス中における
コンタミの形状・凝集状態・成分の分析に

単分散捕集

分級器との組み合わせにより、
任意サイズの粒子捕集が可能



静電分級器 (DMA)
Model : 3082

ドライ/ウェット 高効率捕集



ドライ捕集用
32ウェルプレート



ウェット捕集用
バイアル

ADI社製 スポットサンプラー SS110Aシリーズ

φ25mmシリコンウエハ捕集

φ25mmシリコンウエハへ捕集し
SEM/EDX分析などに活用可能



中心部分に集中捕集するため
微量でも分析しやすい
<捕集部座標 (赤点)>

